Механизмы релаксации продольных фононов в кубических кристаллах германия, кремния и алмаза

© И.Г. Кулеев, И.И. Кулеев

Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук, 620219 Екатеринбург, Россия

E-mail: kuleev@imp.uran.ru

(Поступила в Редакцию 30 марта 2004 г. В окончательной редакции 19 мая 2004 г.)

> В модели анизотропного континуума рассчитаны частоты релаксации продольных тепловых и высокочастотных фононов для трехфононных механизмов рассеяния $L \leftrightarrow L + L$ и $L \leftrightarrow T + L$. Анизотропия ангармонического рассеяния фононов в кубических кристаллах учитывалась через упругие модули второго и третьего порядков. Найдены параметры, определяющие величины частот релаксации продольных фононов для кристаллов германия, кремния и алмаза. Проанализированы длинноволновый предел, переход к модели изотропной среды, а также зависимость частот релаксации тепловых и высокочастотных фононов от температуры и волнового вектора фононов для этих кристаллов.

> Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ № НШ 1380.2003.2, молодежного гранта УрО РАН № 15-02-04, а также Фонда "Династия" и МЦФФМ.

Исследование механизмов релаксации фононов в ангармонических процессах рассеяния представляет интерес не только для изучения решеточной теплопроводности кристаллов [1], но и таких кинетических эффектов, как поглощение ультразвука [2] и термоэдс электронфононного увлечения [3]. Экспериментальные исследования изотопических эффектов в теплопроводности германия, кремния и алмаза [4-8], а также теоретический анализ этих результатов [9,10] показали, что нормальные процессы (N-процессы) фонон-фононного рассеяния играют важную роль в решеточной теплопроводности изотопических обогащенных и химически чистых кристаллов. Эти процессы, в которых полный импульс сталкивающихся фононов сохраняется, вместе с граничным рассеянием фононов являются главными механизмами, ограничивающими максимальные значения теплопроводности в изотопически высокообогащенных кристаллах [9,10].

При расчете теплопроводности в рамках релаксационного метода [4–12] обычно используются выражения для частот релаксации фнонов в N-процессах рассеяния, полученные в длинноволновом приближении: $z_{q\lambda} = \hbar \omega_{q\lambda} / k_{\rm B} T \ll 1 \ (\hbar \omega_{q\lambda}$ — энергия фонона с волновым вектором **q** и поляризацией λ). Это приближение является вполне оправданным при расчете коэффициента поглощения длинноволнового ультразвука, а также термоэдс электрон-фононного увлечения, так как в полупроводниковых кристаллах электроны могут взаимодействовать только с длинноволновыми фононами. Однако в решеточную теплопроводность кристаллов Ge и Si с природным составом изотопов основной вклад вносят тепловые фононы с $z_{q\lambda} \approx 1$, а в изотопически обогащенных кристаллах — тепловые фононы с $z_{q\lambda} \approx 2-4$. Поэтому длинноволновое приближение для частот релаксации фононов не является корректным для расчета теплопроводности. В рамках этого метода параметры, определяющие интенсивность ангармонических процессов рассеяния, являлись подгоночными параметрами теории, которые определялись из сопоставления результатов расчета с экспериментальными данными [4–12]. Для оценки вероятности ангармонических процессов рассеяния обычно использовалась модель изотропной среды. Эта модель не является адекватной для кристаллов германия, кремния и алмаза, а также таких популярных объектов исследования, как InSb, GaAs, CaF₂ и т.д., имеющих кубическую симметрию с существенной анизотропией упругих модулей как второго, так и третьего порядка.

Цель наших исследований — расчет частот релаксации фононов в ангармонических процессах рассеяния на основе экспериментально определенных значений упругих модулей второго и третьего порядков. Определение зависимостей частот релаксации фононов от температуры и волнового вектора в кристаллах Ge, Si и алмаза позволит, во-первых, найти коэффициенты поглоцения как длинноволнового ($z_{q\lambda} \ll 1$), так и высокочастотного ($z_{q\lambda} \gg 1$) ультразвука. Во-вторых, определить эффективные механизмы релаксации тепловых фононов и избавиться от произвола, связанного с выбором двух подгоночных параметров теории при расчете теплопроводности этих кристаллов.

В настоящей работе рассмотрена релаксация продольных фононов в кубических кристаллах в ангармонических процессах рассеяния. В разделе 1 получено выражение для упругой энергии кристалла кубической симметрии через упругие модули второго и третьего порядков. Эта энергия определяет вероятности различных ангармонических трехфононных процессов рассеяния. В разделе 2 вычислены частоты релаксации продольных тепловых и высокочастотных фононов в механизмах $L \leftrightarrow L + L$ и $L \leftrightarrow T + L$ для кристаллов кубической симметрии. Этот расчет дает возможность найти вели-

	C11	C 12	C 44	C111	C112	С 123	C 144	C 155	C 456
Ge Si Алмаз	1.289 1.657 10.76	0.483 0.638 1.25	0.671 0.796 5.758	$-7.10 \\ -8.25 \\ -62.6$	-3.89 -4.51 -22.6	$-0.18 \\ -0.64 \\ 1.12$	$-0.23 \\ 0.12 \\ -6.74$	$-2.92 \\ -3.10 \\ -28.6$	$-0.53 \\ -0.64 \\ -8.23$

Таблица 1. Значения термодинамических модулей упругости для Ge, Si и алмаза (в единицах 10^{12} dyn/cm^2)

чины частот релаксации продольных фононов в ангармонических процессах рассеяния из экспериментально определенных значений упругих модулей. В разделе 3 проанализирована зависимость частот релаксации фононов от температуры и волнового вектора фононов в кристаллах германия, кремния и алмаза. Рассмотрены длинноволновый предел и переход к модели изотропной среды. Проведено сравнение полученных результатов с результатами предыдущих исследований в модели изотропной среды.

Упругая энергия кристаллов 1. кубической симметрии

Выражение для упругой энергии кристаллов кубической симметрии с точностью до членов третьего порядка по компонентам тензора деформации η_{ij} получено в работе [13] (см. также [14]). Преобразуем его аналогично тому, как это сделано в [15] для модели изотропной среды. Поскольку в работах [16-19] экспериментально определены значения термодинамических модулей упругости третьего порядка c_{ijk}, то для упругой энергии кубических кристаллов будем пользоваться нормировкой модулей c_{iik}, принятой Браггером [20]. В этом случае выражение для упругой энергии [13] может быть представлено в более удобном для дальнейших расчетов виде

$$W = \frac{1}{2} c_{11} \left(\sum_{i} \eta_{ii} \right)^{2} + \frac{1}{2} (c_{11} - c_{12} - c_{44}) \sum_{i} \eta_{ii}^{2}$$

+ $c_{44} \sum_{i} \eta_{ik}^{2} + \frac{1}{6} \left\{ \tilde{c}_{111} \sum_{i} \eta_{ii}^{3} + 3\tilde{c}_{112} \sum_{i,k} \eta_{ii}^{2} \eta_{kk} \right\}$
+ $c_{123} \left(\sum_{i} \eta_{ii} \right)^{3} + 6c_{144} \sum_{i,k} \eta_{ii}^{2} \eta_{jk}$
+ $8c_{456} \sum_{i,k} \eta_{ik} \eta_{kj} \eta_{ji} + 12\tilde{c}_{155} \sum_{i,k} \eta_{ii} \eta_{ik}^{2} \right\}.$ (1)

Злесь

$$\tilde{c}_{111} = c_{111} - 3c_{112} + 2c_{123} + 12c_{144} - 12c_{155} + 16c_{456},$$

 $\tilde{c}_{112} = c_{112} - c_{123} - 2c_{144}, \ \tilde{c}_{155} = c_{155} - c_{144} - 2c_{456}.$ (2)

Переход от термодинамических модулей сіік к нормировке, принятой Бирчем $c_{ijk}^{\rm B}$ [13], осуществляется подстановкой

$$c_{111} = 6c_{111}^{B}, \ c_{112} = 2c_{112}^{B}, \ c_{123} = c_{123}^{B}, \ c_{144} = \frac{1}{2}c_{144}^{B},$$
$$c_{155} = \frac{1}{2}c_{155}^{B}, \qquad c_{456} = \frac{1}{4}c_{456}^{B}.$$
(3)

Заметим, что в [19] для термодинамического модуля с456 неправильно указан коэффициент перехода 1/8 к нормировке Бирча (см. также [20,21]). Переход к нормировке, принятой Такером и Рэмптоном [14] для модулей упругости, осуществляется подстановкой

$$c_{ijk}^{TR} = \frac{1}{6} c_{ijk}.$$
 (3a)

Величины модулей упругости второго c_{ik} и третьего c_{ijk} порядков для кристаллов Ge, Si и алмаза приведены в табл. 1.

Выразим компоненты тензора деформации η_{ik} через компоненты тензора дисторсии $\xi_{ik}[22]$

$$\eta_{ik} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} + \sum_j \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \frac{\partial u_j}{\partial x_k} \right)$$
$$\equiv \frac{1}{2} \left(\xi_{ik} + \xi_{ki} + \sum_j \xi_{ji} \xi_{jk} \right). \tag{4}$$

Подстановка выражения (4) в (1) дает

$$W = \frac{1}{2}c_{11}\left(\sum_{i}\xi_{ii}\right)^{2} + \frac{1}{2}(c_{11} - c_{12} - 2c_{44})\sum_{i}\xi_{ii}^{2}$$

+ $\frac{1}{4}c_{44}\sum_{i}(\xi_{ik} + \xi_{ki})^{2} + \frac{1}{6}\left\{\tilde{c}_{111}\sum_{i}\xi_{ii}^{3} + 3\tilde{c}_{112}\sum_{i,k}\xi_{ii}^{2}\xi_{kk}\right\}$
+ $c_{123}\left(\sum_{i}\xi_{ii}\right)^{3} + 3c_{144}\sum_{i,j,k}\xi_{ii}\xi_{jk}\xi_{kj}$
+ $3(c_{144} + c_{12})\sum_{i,j,k}\xi_{ii}\xi_{jk}^{2} + 2c_{456}\sum_{i,j,k}\xi_{ik}\xi_{kj}\xi_{ji}$
+ $6(c_{44} + c_{456})\sum_{i,j,k}\xi_{ik}\xi_{ji}\xi_{jk} + 3\tilde{c}_{155}\sum_{i,k}(\xi_{ii}\xi_{ik}^{2} + 2\xi_{ii}\xi_{ik}\xi_{ki})$
+ $3[\tilde{c}_{155} + (c_{11} - c_{12} - 2c_{44})]\sum_{i,k}\xi_{ii}\xi_{ik}^{2}\right\}.$ (5)

i.*k*

Таблица 2. Значения упругих модулей ΔC , \tilde{c}_{111} , \tilde{c}_{112} , \tilde{c}_{155} для Ge, Si и алмаза (в единицах 10^{12} dyn/cm²)

	Ge	Si	Алмаз
ΔC	-0.54	-0.57	-2.01
\tilde{c}_{155}	-1.63	-1.9	-5.4
\tilde{c}_{112}	-3.25	-4.1	-10.24
\tilde{c}_{111}	28.01	32.4	138.1

Кубические члены по ξ_{ik} в (5) отвечают за взаимодействие между фононами. Как видно из выражения (5), нелинейная связь тензора деформации η_{ik} с компонентами тензора дисторсии ξ_{ik} приводит к тому, что вклад в релаксацию фононов вносят не только модули упругости третьего порядка, но и модули упругости второго порядка. Рассмотрим переход от упругой энергии кристаллов кубической симметрии к упругой энергии изотропной среды W_{iso} , выражение для которой получено в [15] (формула (4.6)). Из условия $\Delta W = W_k \cdot W_{iso} = 0$ найдем

$$\Delta C = c_{11} - c_{12} - 2c_{44} = 0,$$

$$\tilde{c}_{112} = c_{112} - c_{123} - 2c_{144} = 0,$$

$$\tilde{c}_{155} = c_{155} - c_{144} - 2c_{456} = 0,$$

$$\tilde{c}_{111} = c_{111} - 3c_{112} + 2c_{123}$$

$$+12c_{144} - 12c_{155} + 16c_{456} = 0. \tag{6}$$

Представим смещение частицы в стандартном виде [15]

$$u_i(x) = i \sum_{\mathbf{q}} \left(\frac{\hbar}{2\rho V \omega_{\mathbf{q}\lambda}}\right)^{1/2} e_i^{\lambda} e^{i\mathbf{q}\mathbf{r}} (b_{\mathbf{q}\lambda} - b_{-\mathbf{q}\lambda}^+), \qquad (7)$$

где $b^+_{-q\lambda}$, $b_{q\lambda}$ — операторы рождения и уничтожения фононов, ρ — плотность, V — нормировочный объем, **е** — вектор поляризации, $\omega_{q\lambda}$ — частота фонона с волновым вектором **q** и поляризацией волны λ . Как видно из (7), каждой величине ξ_{ij} будет соответствовать коэффициент e_iq_j . Подстановка (7) в (5) дает следующее выражение для плотности энергии, связанной с агнармонизмом колебаний решетки:

$$\begin{split} W &= -\frac{i}{6} \sum_{\substack{q_1, q_2, q_3 \\ \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}} \left(\frac{\hbar}{2\rho V} \right)^{3/2} (\omega_{\mathbf{q}_1 \lambda_1} \omega_{\mathbf{q}_2 \lambda_2} \omega_{\mathbf{q}_3 \lambda_3})^{-1/2} \\ &\times (b_{\mathbf{q}_1 \lambda_1} - b^+_{-\mathbf{q}_1 \lambda_1}) (b_{\mathbf{q}_2 \lambda_2} - b^+_{-\mathbf{q}_2 \lambda_2}) (b_{\mathbf{q}_3 \lambda_3} - b^+_{-\mathbf{q}_3 \lambda_3}) \\ &\times \exp(i(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3)\mathbf{r}) V_{\mathbf{q}_1 \mathbf{q}_2 \mathbf{q}_3}^{\lambda_1 \lambda_2 \lambda_3}, \end{split}$$

$$\begin{aligned} V_{\mathbf{q}_{1}\mathbf{q}_{2}\mathbf{q}_{3}}^{\lambda_{1}\lambda_{2}\lambda_{3}} &= \tilde{c}_{111} \sum_{i} e_{1i}q_{1i}e_{2i}q_{2i}e_{3i}q_{3i} + c_{123}(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{1})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{3}) \\ &+ \tilde{c}_{112} \sum_{i} \left[(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{1})e_{2i}q_{2i}e_{3i}q_{3i} + (\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{2})e_{1i}q_{1i}e_{3i}q_{3i} \\ &+ (\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{3})e_{1i}q_{1i}e_{2i}q_{2i} \right] + c_{144} \left[(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{1})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{2}) \\ &+ (\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{1}) + (\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{1}) \right] \\ &+ (c_{12} + c_{144}) \left[(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{1})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{e}_{3})(\mathbf{q}_{3}\mathbf{q}_{2}) + (\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{e}_{3})(\mathbf{q}_{3}\mathbf{q}_{1}) \\ &+ (\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{e}_{2})(\mathbf{q}_{1}\mathbf{q}_{2}) \right] \\ &+ c_{456} \left[(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{1})(\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{2}) + (\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{1}) \right] \\ &+ (c_{44} + c_{456}) \left[(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{q}_{1}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{e}_{3}) + (\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{q}_{1}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{e}_{3}) \\ &+ (\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{1})(\mathbf{q}_{2}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{e}_{2}) + (\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{q}_{1}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{e}_{2}\mathbf{e}_{3}) \\ &+ (\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{1})(\mathbf{q}_{2}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{e}_{2}) + (\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{2})(\mathbf{q}_{1}\mathbf{q}_{3})(\mathbf{e}_{1}\mathbf{e}_{2}) \right] \\ &+ \tilde{c}_{155} \sum_{i} \left\{ e_{1i}e_{2i}e_{3i}\left(q_{1i}(\mathbf{q}_{2}\mathbf{q}_{3}) + q_{2i}(\mathbf{q}_{i}\mathbf{q}_{3}) + q_{3i}(\mathbf{q}_{1}\mathbf{q}_{2}) \right) \\ &+ e_{1i}q_{1i}[e_{2i}q_{3i}(\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{1}) + e_{3i}q_{2i}(\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{3})] \\ &+ e_{2i}q_{2i}[e_{1i}q_{3i}(\mathbf{e}_{3}\mathbf{q}_{1}) + e_{3i}q_{1i}(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{2})] \right\} + \left[\tilde{c}_{155} + \Delta C \right] \\ &\times \sum_{i} q_{1i}q_{2i}q_{3i} \left[e_{1i}q_{2i}(\mathbf{e}_{2}\mathbf{q}_{1}) + e_{2i}q_{1i}(\mathbf{e}_{1}\mathbf{q}_{3}) + e_{3i}(\mathbf{e}_{1}\mathbf{e}_{2}) \right]. \tag{8}$$

Из формулы (8) при выполнении условий (6) следует выражение для плотности энергии, обусловленной ангармонизмом колебаний решетки, для изотропной среды (формула (4.22) из [15]). Слагаемые, содержащие модули упругости третьего порядка $\tilde{c}_{111}, \tilde{c}_{112}$ и $\tilde{c}_{155},$ отличают кубические кристаллы от изотропной среды. Рассмотрим условия (6) для кристаллов Ge, Si и алмаза, используя результаты измерений модулей упругости второго и третьего порядков, приведенные в табл. 1. Проведенный анализ показал (табл. 2), что для рассматриваемых кристаллов соотношения (6) не выполняются не только для упругих модулей второго порядка, но и для упругих модулей третьего порядка: для Ge, Si и алмаза величина $|\Delta C| \sim c_{12}$, а значение модуля \tilde{c}_{155} превышает более, чем в 2 раза величину исходного модуля с 155. Наибольшее отклонение от модели изотропной среды имеет место для модуля упругости \tilde{c}_{111} , он не только значительно превосходит остальные модули третьего порядка для Ge, Si и алмаза, но и имеет знак, противоположный знаку исходного модуля с 111. Поэтому наибольшее отклонение от модели изотропной среды будет иметь место для тех частот релаксации, в которые вносят вклад члены, содержащие упругий модуль \tilde{c}_{111} . После интегрирования по нормировочному объему получаем матричный элемент $V_{\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2\mathbf{q}_3}^{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}$, квадрат модуля которого определяет вероятность рассеяния фононов в ангармонических процессах рассеяния. Выражение (8) позволяет исследовать различные механизмы трехфононных процессов рассеяния и рассчитать соответствующие частоты релаксации фононов в ангармонических процессах рассеяния в кубических кристаллах.

2. Механизмы релаксации продольных фононов в кубических кристаллах

Основными механизмами релаксации продольных фононов в кубических кристаллах являются следующие [15,23]:

(1)
$$L + L \rightarrow L, \qquad \omega_{\mathbf{q}_{3}}^{L} = \omega_{\mathbf{q}_{1}}^{L} + \omega_{\mathbf{q}_{2}}^{L},$$
$$L \rightarrow L + L, \qquad \omega_{\mathbf{q}_{1}}^{L} = \omega_{\mathbf{q}_{2}}^{L} + \omega_{\mathbf{q}_{3}}^{L},$$
(2)
$$L + T \rightarrow L, \qquad \omega_{\mathbf{q}_{3}}^{L} = \omega_{\mathbf{q}_{1}}^{L} + \omega_{\mathbf{q}_{2}}^{T},$$
$$L \rightarrow T + L, \qquad \omega_{\mathbf{q}_{1}}^{L} = \omega_{\mathbf{q}_{2}}^{T} + \omega_{\mathbf{q}_{3}}^{L},$$
(3)
$$L + T \rightarrow T, \qquad \omega_{\mathbf{q}_{3}}^{T} = \omega_{\mathbf{q}_{1}}^{L} + \omega_{\mathbf{q}_{2}}^{T},$$
$$L \rightarrow T + T, \qquad \omega_{\mathbf{q}_{1}}^{L} = \omega_{\mathbf{q}_{2}}^{T} + \omega_{\mathbf{q}_{3}}^{T}.$$
(9)

В первом столбце приведены процессы "слияния" (S-процессы) продольного фонона с продольным (1) или с поперечным (2), в результате которого возникают продольный (1) и (2) или поперечный фонон (3). Во втором столбце приведены процессы распада (*R*-процессы) продольного фонона на два продольных (1), на поперечный и продольный (2), а также на два поперечных фонона (3).

Далее приведем расчет частот релаксации фононов для процессов (1) и (2) в кубических кристаллах. Определим их величины, а также зависимости частот релаксации от температуры и волнового вектора фононов, используя приведенные в табл. 1 и 2 значения упругих модулей. Выражение для частоты релаксации фононов, согласно [12], имеет вид

$$\nu_{\rm phN}(q_1,\lambda_1) = \frac{\pi\hbar^4}{(2\rho k_{\rm B}T)^3} \frac{1}{V} \sum_{\substack{\mathbf{q}_2\mathbf{q}_3\\\lambda_2\lambda_3}} \frac{\mathrm{sh}\left(\frac{z_1}{2}\right)\delta_{\mathbf{q}_1+\mathbf{q}_2+\mathbf{q}_3,0}}{z_1 z_2 z_3 \,\mathrm{sh}\left(\frac{z_2}{2}\right) \,\mathrm{sh}\left(\frac{z_3}{2}\right)} \\ \times \left|V_{\mathbf{q}_1\mathbf{q}_2\mathbf{q}_3}^{\lambda_1\lambda_2\lambda_3}\right|^2 \Big\{ 2\delta(\omega_{\mathbf{q}_1\lambda_1} + \omega_{\mathbf{q}_2\lambda_2} - \omega_{\mathbf{q}_3\lambda_3}) \\ + \delta(\omega_{\mathbf{q}_1\lambda_1} - \omega_{\mathbf{q}_2\lambda_2} - \omega_{\mathbf{q}_3\lambda_3}) \Big\}.$$
(10)

Первое слагаемое в фигурных скобках обусловлено *S*-процессами, а второе — *R*-процессами.

Для механизма релаксации фононов *LLL* (процесс (1) в формуле (9)) выполняются соотношения

$$(\mathbf{e}_1\mathbf{q}_1) = q_1, \quad (\mathbf{e}_2\mathbf{q}_2) = q_2, \quad (\mathbf{e}_3\mathbf{q}_3) = q_3,$$

 $\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 = \mathbf{q}_3 \quad (S$ -процессы);
 $\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 \quad (R$ -процессы). (11)

Учитывая соотношения (11), выразим матричный элемент (8) для R- и S-процессов в механизме релаксации *LLL* через модули векторов \mathbf{q}_1 и \mathbf{q}_2 и углы θ и ф между ними

$$\begin{aligned} V_{(S,R)}^{IIL} &= q_1 q_2 q_3 \Biggl\{ (c_{123} + c_{12} + 2c_{144}) \\ &+ \left(\frac{q_2}{q_3}\right)^2 \Biggl[\cos \theta \left(\frac{q_1}{q_2} \pm \cos \theta \right) \\ &\times \Biggl\{ (2A_{\text{cub}} + 4\tilde{c}_{155} + \Delta C) \left(\frac{q_1}{q_2} \cos \theta \pm 1 \right) \Biggr\} \\ &+ (4\tilde{c}_{155} + \Delta C + \tilde{c}_{111} + 2\tilde{c}_{112}) \Biggl(\cos \theta \left(\frac{q_1}{q_2} \pm \cos \theta \right) \Biggr)^2 \\ &+ \tilde{c}_{112} \Biggl(\left(\frac{q_1}{q_2} \pm \cos \theta \right)^2 + (\cos \theta \sin \theta)^2 \\ &+ (\sin \theta)^4 ((\sin \varphi)^4 + (\cos \varphi)^4) \Biggr) \Biggr] \Biggr\}. \end{aligned}$$
(12)

Изотропному расссеянию продольных фононов соответствует первое слагаемое в выражениях (12), а также члены, содержащие коэффициент A_{cub}. Остальные слагаемые связаны с кубической анизотропией — они исчезают при переходе к модели изотропной среды. Для кубического кристалла имеем

$$A_{\rm cub} = c_{12} + 3c_{44} + 2c_{144} + 4c_{456}.$$
 (13)

Переходя к изотропному случаю при помощи соотношений (6), для A_{cub} получим результат [15]

$$A_{\rm cub} = A_{\rm iso} = A_1 + 3A_2 + A_3 + A_4 = 1.5c_{11} - 0.5c_{12} + 2c_{155}$$

= 1.5c_{11} - 0.5c_{12} + 12c_{155}^{TR} (13a)

(коэффициенты A_1, A_2, A_3, A_4 определены в [15]).

Следует отметить, что в дебаевском приближении для спектра фононов из закона сохранения энергии следует, что в механизме LLL могут взаимодействовать только коллинеарные фононы [1,22]. Учет дисперсии фононов приводит к обращению в нуль вероятности рассеяния фононов в этом механизме рассеяния. Однако ангармонические процессы рассеяния, а также рассеяния на дефектах, примесях и границах приводят к конечному времени жизни фононов. Поэтому при учете затухания фононных состояний следует заменить б-функции, учитывающие закон сохранения энергии в процессах слияния и распада продольных фононов, на лоренцовскую функцию, которая учитывает затухание фононов [1,22]. Для корректного анализа влияния затухания фононных состояний в механизме LLL необходимо найти суммарную частоту релаксации продольных фононов, которая определяется всеми процессами релаксации (9). Когда столкновительное уширение фононных состояний $\gamma_L(q_1)$ гораздо меньше энергии фононов ($\hbar\omega_{\mathbf{q}}$, и $\hbar\omega_{\mathbf{q}_3}$), лоренцовская функция имеет острый максимум при $\cos \theta \approx 1$. В данном расчете ограничимся этим приближением и

$$V_{(S,R)}^{LLL} = (3c_{11} + c_{111}) q_1 q_2 (q_1 \pm q_2).$$
(14)

Это выражение не изменяется при переходе к приближению изотропной среды, в чем нетрудно убедиться, если воспользоваться соотношениями (6). Подстановка (13) в (10) дает выражение для частоты релаксации фононов в механизме *LLL*

$$\nu_{\rm phN}^{LLL} = B_{LLL}T^5 \operatorname{sh}(z_1/2) \\ \times \left\{ 2 \int_0^{z_{DL}} dz_2 \frac{z_2^2(z_1 + z_2)^2}{\operatorname{sh}(\frac{z_2}{2}) \operatorname{sh}(\frac{z_1 + z_2}{2})} + \int_0^{z_1} dz_2 \frac{z_2^2(z_1 - z_2)^2}{\operatorname{sh}(\frac{z_2}{2}) \operatorname{sh}(\frac{z_1 - z_2}{2})} \right\}, \\ B_{LLL} = \frac{(3c_{11} + c_{111})^2(k_{\rm B})^5}{32\pi\hbar^4\rho^3 S_1^9}.$$
(15)

Итак, выражение (15) позволяет исследовать зависимость частоты релаксации фононов от температуры и волнового вектора фононов в механизме *LLL* для кубических кристаллов в предположении о слабом затухании фононных состояний.

Для механизма релаксации фононов *LTL* (процесс (2) в формуле (9)) выполняются соотношения

$$(\mathbf{e}_1\mathbf{q}_1) = q_1, \ (\mathbf{e}_2\mathbf{q}_2) = 0, \ (\mathbf{e}_3\mathbf{q}_3) = q_3, \ (\mathbf{e}_2\mathbf{q}_1) = (\mathbf{e}_2\mathbf{q}_3);$$

 $\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2 = \mathbf{q}_3 \ (S), \ \mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_2 + \mathbf{q}_3 \ (R).$ (16)

Учитывая соотношения (16), выразим матричный элемент (7) для S- и R-процессов в механизме релаксации LTL через компоненты вектора поляризации поперечного фонона \mathbf{e}_2 и угловые координаты θ и φ вектора \mathbf{q}_2

$$V_{(S,R)}^{LTL} = \pm \frac{q_1^3 q_2}{q_3} \Biggl\{ A_{(S,R)}(\theta) e_{2z} + b_{(S,R)} \\ \times \Biggl[e_{2x} \left(\frac{q_{2x}}{q_2} \right)^3 + e_{2y} \left(\frac{q_{2y}}{q_2} \right)^3 \Biggr] \Biggr\},$$
(17)

$$A_{(S,R)}(\theta) = \cos\theta \left\{ \left(\tilde{c}_{111} + \tilde{c}_{112} + 8\tilde{c}_{155} + 2\Delta C \right) \right.$$

$$\times \left(1 \pm \frac{q_2}{q_1} \cos\theta \right)^2 + \tilde{c}_{112} \left(\frac{q_3}{q_1} \right)^2 \right\} + \left(1 \pm \frac{q_2}{q_1} \cos\theta \right)$$

$$\times \left\{ \left(A_{\text{cub}} + 2\tilde{c}_{155} \right) \left(2\cos\theta \pm \frac{q_2}{q_1} \right) + \Delta C\cos\theta \right\},$$

$$b_{(S,R)} = \tilde{c}_{112} \left(\frac{q_2}{q_1} \right)^2.$$
(18)

1

Изотропному рассеянию фононов в выражениях (18) соответствуют члены, содержащие коэффициенты A_{cub} (формулы (13) и (13а)), а остальные слагаемые связаны с кубической анизотропией — они исчезают при переходе к модели изотропной среды (соотношения (6)).

Как видно из выражения (17), квадрат матричного элемента, определяющего вероятность трехфононных процессов рассеяния *LTL*, зависит от произведения различных компонент вектора поляризации \mathbf{e}_2 и волнового вектора фонона \mathbf{q}_2 . В общем случае частота релаксации ν_{phN}^{LTL} , как и собственные частоты фононов, зависит от направления распространения продольного фонона относительно кристаллографических осей. Далее упростим задачу и ограничимся рассмотрением одного из симметричных направлений ([100], [001], [111] и т.д.), направив ось Z и волновой вектор фонона \mathbf{q}_1 вдоль этого направления. Тогда, воспользовавшись соотношением $\mathbf{e}_2\mathbf{q}_2 = \mathbf{0}$, выразим компоненты вектора поляризации поперечного фонона \mathbf{e}_2 через угловые координаты θ и φ вектора \mathbf{q}_2

$$e_{2x} = \cos\theta\cos\varphi\cos\varphi_e - \sin\varphi_e\sin\varphi,$$

$$e_{2y} = \cos\theta\sin\varphi\cos\varphi_e + \sin\varphi_e\cos\varphi,$$

$$e_{2z} = -\sin\theta\cos\varphi_e.$$
 (19)

Угол φ_e характеризует направление вектора поляризации поперечного фонона \mathbf{e}_2 в плоскости, перпендикулярной вектору q2. Рассмотрим более подробно операцию усреднения вероятности рассеяния фононов в механизме релаксации LTL по векторам поляризации поперечных фононов. Дело в том, что такая процедура в литературе не описана, а в ряде расчетов частот релаксации в модели изотропной среды выбиралось конкретное направление вектора поляризации поперечного фонона е2 относительно векторов q_1 и q_2 . Так, например, в [24] полагалось, что вектор e_2 лежит в плоскости векторов q_1 и q2. Если в модели изотропной среды такое приближение приводит к потере численного множителя 1/2 для механизма релаксации LTL [24], то в кубических кристаллах это приближение приведет к потере важных слагаемых в вероятности трехфононных процессов рассеяния. Приведем результаты усреднения квадрата матричного элемента (17) по векторам поляризации e_2 и углу ф

$$\langle (e_{2z})^2 \rangle_{\varphi_2,\varphi_e} = \int_0^{2\pi} d\varphi_2 \int_0^{2\pi} d\varphi_e (e_{2z})^2 = \pi \sin^2 \theta,$$

$$\left\langle (e_{2x})^2 \left(\frac{q_{2x}}{q_2}\right)^6 \right\rangle = \left\langle (e_{2y})^2 \left(\frac{q_{2y}}{q_2}\right)^6 \right\rangle$$

$$= \frac{5\pi}{16} \sin^6 \theta \left(1 - \frac{7}{8} \sin^2 \theta\right),$$

$$2 \left\langle e_{2z} \left[e_{2x} \left(\frac{q_{2x}}{q_2}\right)^3 + e_{2y} \left(\frac{q_{2y}}{q_2}\right)^3 \right] \right\rangle = -\frac{3\pi}{2} \sin^4 \theta \cos \theta,$$

$$2 \left\langle e_{2x} e_{2y} \left(\frac{q_{2x} q_{2y}}{q_2^2}\right)^3 \right\rangle = -\frac{3\pi}{64} \sin^8 \theta.$$
(20)

После усреднения рассеяния по углам φ_e и φ вероятность рассеяния остается функцией только модулей векторов \mathbf{q}_1 и \mathbf{q}_2 и угла θ между ними. Интеграл по θ в выражении (10) легко вычисляется при помощи δ -функции, учитывающей закон сохранения энергии в процессах слияния и распада продольного фонона

$$\cos \theta_R = S^* + \frac{q_2}{2q_1} \left(1 - S^{*2}\right) = S^* \left(1 + \frac{z_2}{2z_1} \left(\frac{1}{S^{*2}} - 1\right)\right),$$

$$z_2 \le z_{2mR},$$

$$\cos \theta_S = S^* - \frac{q_2}{2q_1} \left(1 - S^{*2}\right) = S^* \left(1 - \frac{z_2}{2z_1} \left(\frac{1}{S^{*2}} - 1\right)\right),$$

$$z_2 \le z_{2mS},$$

$$z_{2mR} = \frac{2S^* z_1}{1 + S^*}, \quad z_{2mS} = \frac{2S^* z_1}{1 - S^*}, \quad S^* = \frac{S_t}{S_L},$$
$$z_2 = \frac{\hbar \omega_{q2}}{k_{BT}}, \quad z_1 = \frac{\hbar \omega_{q1}}{k_B T}, \tag{21}$$

где S_t и S_L — скорости поперечных и продольных фононов соответственно.

После подстановки формул (18)–(21) в (10) вероятность рассеяния фононов в механизме релаксации *LTL* становится функцией отношения приведенных волновых векторов z_1 и z_2 . В целях упрощения записи окончательного выражения для частоты v_{phN}^{LTL} преобразуем оставшиеся интегралы с помощью подстановки

$$z_2 = \frac{2S^*z_1}{1+S^*} y$$
 (для *R*-процессов),
 $z_2 = \frac{2S^*z_1}{1-S^*} y$ (для *S*-процессов). (22)

После несложных преобразований получим

$$\begin{split} v_{\text{phN}}^{LTL} &= B_{LTL} T^5 z_1^5 \operatorname{sh}(z_1/2) \big\{ 2(1+S^*) J_S + (1-S^*) J_R \big\}, \\ J_{S,R} &= \int_0^1 dy \, \frac{y^2 B_{S,R}(y) \varphi_{1S,R}(y)}{\left(\frac{(1+S^*)}{2S^*} \pm y\right)^2 \operatorname{sh}\left(\frac{S^* z_{1Y}}{(1+S^*)}\right) \operatorname{sh}\left(\frac{z_1}{2} (1 \pm \frac{2S^* y}{(1+S^*)})\right)}; \\ B_{LTL} &= \frac{(C_A)^2 (k_B)^5}{16\pi \hbar^4 \rho^3 S_I S_L^8}, \quad C_A = \tilde{c}_{111} + \tilde{c}_{112} + 8\tilde{c}_{155} + 2\Delta C. \end{split}$$

Функции $B_S(y)$ и $B_R(y)$ определяются выражениями

$$\begin{split} B_{S}(y) &= A_{S}(y) \left[A_{S}(y) - 6P_{112} \frac{1+S^{*}}{1-S^{*}} y^{2} \varphi_{0S} \varphi_{1S} \right] \\ &+ 10 \left(P_{112} \frac{1+S^{*}}{S^{*}(1-S^{*})} \right)^{2} y^{4} \varphi_{1S}^{2} \left(1 - \frac{19}{20} (1-S^{*2}) \varphi_{1S} \right), \end{split}$$
(24)
$$B_{R}(y) &= A_{R}(y) \left[A_{R}(y) - 6P_{112} \frac{1-S^{*}}{1+S^{*}} y^{2} \varphi_{0R} \varphi_{1R} \right] \\ &+ 10 \left(P_{112} \frac{1-S^{*}}{S^{*}(1+S^{*})} \right)^{2} y^{4} \varphi_{1R}^{2} \left(1 - \frac{19}{20} (1-S^{*2}) \varphi_{1R} \right), \end{split}$$

$$A_{S}(y) = \varphi_{0S}(y) \left[\left(\varphi_{2S}(y) \right)^{2} + P_{112} \left(1 + \frac{2S^{*}}{1 - S^{*}} y \right)^{2} \right] + \varphi_{2S}(y) \left[P_{AC} \varphi_{3S}(y) + P_{\Delta} \varphi_{0S}(y) \right], A_{R}(y) = \varphi_{0R}(y) \left[\left(\varphi_{2R}(y) \right)^{2} + P_{112} \left(1 + \frac{2S^{*}}{1 + S^{*}} y \right)^{2} \right] + \varphi_{2R}(y) \left[P_{AC} \varphi_{3R}(y) + P_{\Delta} \varphi_{0R}(y) \right], P_{112} = \frac{\tilde{c}_{112}}{C_{A}}, \quad P_{AC} = \frac{A_{\text{cub}} + 2\tilde{c}_{155}}{C_{A}}, \quad P_{\Delta}^{+} = \frac{\Delta C}{C_{A}}.$$
(25)

Функции φ_{nS} и φ_{nR} связаны с угловой зависимостью матричного элемента (формулы (17), (18)). После подстановки (21) они становятся функциями отношения приведенных волновых векторов (22), причем ряд из них обращается в нуль в пределах области интегрирования. Это приводит к существенному изменению вкладов различных модулей упругости третьего порядка в частоту релаксации и к сложной немонотонной зависимости вероятности рассеяния продольных фононов от отношения приведенных волновых векторов. Выражения для этих функций имеют вид

$$\varphi_{0S}(y) = 1 - \frac{1+S^*}{S^*} y, \ \varphi_{1S}(y) = (1-y) \left(1+y\frac{1+S^*}{1-S^*}\right),$$

$$\varphi_{2S}(y) = \left(1-y\left(\frac{\sqrt{2-(S^*)^2}-S^*}{1-S^*}\right)\right)$$

$$\times \left(1+y\left(\frac{\sqrt{2-(S^*)^2}+S^*}{1-S^*}\right)\right),$$

$$\varphi_{3S}(y) = 2 + \frac{2S^*y}{1-S^*},$$

$$\varphi_{0R}(y) = 1 + \frac{1-S^*}{S^*} y, \ \varphi_{1R}(y) = (1-y) \left(1+y\frac{1-S^*}{1+S^*}\right),$$

$$\varphi_{2R}(y) = \left(1-y\left(\frac{\sqrt{2-(S^*)^2}+S^*}{1+S^*}\right)\right)$$

$$\times \left(1+y\left(\frac{\sqrt{2-(S^*)^2}-S^*}{1+S^*}\right)\right),$$

$$\varphi_{3R}(y) = 2 - \frac{2S^*y}{1+S^*}.$$
(26)

Выражения (23)–(26) позволяют исследовать зависимость частоты релаксации в механизме *LTL* от температуры и волнового вектора фононов для кубических кристаллов.

Реультаты численного анализа частот релаксации продольных фононов для кристаллов германия, кремния и алмаза

Рассмотрим зависимость частот релаксации продольных фононов от температуры и волнового вектора фононов в механизмах *LLL* и *LTL* для кристаллов

	$B^{0}_{LLL}, \\ s^{-1}K^{-5} \\ [100]$	$B_{LLL}^{0}, \\ s^{-1}K^{-5} \\ [110]$	$B^{0}_{LLL}, \\ s^{-1}K^{-5} \\ [111]$	$B_{LLL}^{R}, \ { m s}^{-1}{ m K}^{-5}$ [100]	$ B_{LLL}^{R}, s^{-1}K^{-5} [110] $	$B_{LLL}^{R},$ s ⁻¹ K ⁻⁵ [111]
Ge Si Алмаз	$\begin{array}{c} 1.72 \\ 0.166 \\ 5.79 \cdot 10^{-3} \end{array}$	$0.73 \\ 0.081 \\ 3.87 \cdot 10^{-3}$	$0.57 \\ 0.065 \\ 3.35 \cdot 10^{-3}$	$\begin{array}{c} 1.11\cdot 10^{-3} \\ 1.07\cdot 10^{-4} \\ 3.72\cdot 10^{-6} \end{array}$	$\begin{array}{c} 4.72 \cdot 10^{-4} \\ 5.2 \cdot 10^{-5} \\ 2.49 \cdot 10^{-6} \end{array}$	$\begin{array}{c} 3.69\cdot 10^{-4} \\ 4.2\cdot 10^{-5} \\ 2.15\cdot 10^{-6} \end{array}$

Таблица 3. Значения параметров, определяющих частоты релаксации продольных фононов в механизме *LLL* в кристаллах Ge, Si и алмаза

кубической симметрии германия, кремния и алмаза. Для механизма *LLL* в длинноволновом пределе $z_1 \ll 1$ из формулы (15) следует

$$\nu_{\rm phN}^{LLL} \cong B_{LLL}^0 T^5 z_1,$$

$$B_{LLL}^0 \cong \frac{16\pi^4}{15} B_{LLL} = \frac{\pi^3 (3c_{11} + c_{111})^2 k_{\rm B}^5}{30\hbar^4 a^3 S^9}.$$
(27)

В этом случае основной вклад в частоту релаксации продольных фононов вносят процессы слияния фононов, и величина v_{phN}^{LLL} линейно зависит от волнового вектора фононов, как и в случае изотропной среды [2,23]. Выражение для коэффициента B_{LLL}^0 отличается от результата, полученного Марисом для изотропной среды (формула (239) в [23]), в 4 раза. Это отличие связано с тем, что при усреднении квадрата матричного элемента (14) не появляется множитель 1/4, который возникает при усреднении квадрата обобщенного параметра Грюнайзена по угловым переменным (формулы (238)–(239) в [23]). Очевидно, что использование обобщенного параметра Грюнайзена [23] не является адекватной процедурой для кубических кристаллов.



Рис. 1. Зависимости частот релаксации продольных фононов в механизме *LLL:* 1 — функция $v_{LLL}^*(z_1)$, 2 — вклад *S*-процессов, 3 — вклад *R*-процессов. Штриховыми линиями приведены аппроксимации: 1*a* — функция $v_{LLL}^*(z_1)$ для тепловых фононов согласно (31), 2*a* — вклад *S*-процессов в линейной аппроксимации (27), 3*a* — вклад *R*-процессов согласно (29).

Проанализируем зависимость частоты релаксации ν_{phN}^{LTL} волнового вектора фононов в кристаллах кубической симметрии для тепловых и высокочастотных фононов ($z_1 > 1$). Как видно из выражения (15), величина

$$\nu_{LLL}^{*}(z_{1}) = \frac{\nu_{phN}^{LLL}(z_{z}, T)}{B_{LLL}^{0}T^{5}} = \nu_{LLL}^{*(S)}(z_{1}) + \nu_{LLL}^{*(R)}(z_{1})$$
(28)

является функцией только приведенного волнового вектора фононов z_1 для всех рассматриваемых кристаллов. На рис. 1 приведены зависимости функций $v_{LLL}^*(z_1)$, $v_{LLL}^{*(S)}(z_1)$ и $v_{LLL}^{*(R)}(z_1)$ от волнового вектора фононов. Как видно из него, полная частота релаксации $v_{LLL}^*(z_1)$ является монотонно возрастающей функцией z_1 , причем при $z_1 < 2.5$ доминирующий вклад в нее вносят *S*-процессы, и она может быть аппроксимирована линейной функцией z_1 вклад *R*-процессов определяется выражением

$$\nu_{LLL}^{*(R)}(z_1) \cong \frac{5}{4\pi^4} z_1^4.$$
(29)

При $z_1 = 1$ он в 312 меньше, чем вклад *S*-процессов. Однако с увеличением волнового вектора фононов роль процессов распада быстро возрастает и при $z_1 = 6.3$ величины $v_{LLL}^{*(S)}(z_1)$ и $v_{LLL}^{*(R)}(z_1)$ сравниваются. При $z_1 \gg 1$ доминирующий вклад в частоту релаксации продольных фононов в кристаллах Ge, Si и алмаза вносят *R*-процессы (кривая *3* на рис. 1); вклад этих процессов пропорционален пятой степени волнового вектора

$$\nu_{\rm phN}^{LLL(R)} \cong B_{LLL}^{(R)} T^5 z_1^5, \quad B_{LLL}^{(R)} = \frac{1}{15} B_{LLL},$$
$$\nu_{LLL}^{*(R)}(z_1) \cong \frac{1}{16\pi^4} z_1^5. \tag{30}$$

В этом предельном случае вклад *S*-процессов возрастает существенно медленнее — он пропорционален второй степени волнового вектора

$$\nu_{\rm phN}^{LLL}(z_1) \cong \frac{15J_2}{4\pi^4} z_1^2, \quad J_2 = \int_0^{z_{DL}} dz_2 \frac{z_2^2}{\exp(z_2) - 1} \cong 2.4.$$
(30a)

Как и должно быть в рассмотренном приближении, полученные зависимости частот релаксации продольных

	B_{LTL}^0 ,	B_{LTL}^0 ,	B_{LTL}^0 ,	B_{LTL}^{R} ,	B_{LTL}^{R} ,	B_{LTL}^{R} ,
	$s^{-1}K^{-5}$	$s^{-1}K^{-5}$	$s^{-1}K^{-5}$	$s^{-1}K^{-5}$	$s^{-1}K^{-5}$	$s^{-1}K^{-5}$
	[100]	[110]	[111]	[100]	[110]	[111]
Ge	1.02	0.26	0.092	$4.16\cdot 10^{-4}$	$3.72\cdot 10^{-4}$	$2.43\cdot 10^{-4}$
Si	0.09	0.02	0.018	$3.82 \cdot 10^{-5}$	$4.09 \cdot 10^{-5}$	$2.77\cdot 10^{-5}$

0.0011

 $1.99\cdot 10^{-6}$

Таблица 4. Значения параметров, определяющих частоты релаксации продольных фононов в механизме *LTL* в кристаллах Ge, Si и алмаза

фононов в механизме *LLL* для кубических кристаллов (27) и (30) и изотропных сред [25] совпадают. Значения коэффициентов B_{LLL}^0 и $B_{LLL}^{(R)}$ для кристаллов германия, кремния и алмаза в различных кристалло-графических направлениях приведены в табл. 3, из которой следует, что в направлении [100] при T = 10 К и $z_1 = 1$ величина v_{phN}^{LLL} составляет $1.72 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$ для Ge, $1.66 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$ для Si и $5.79 \cdot 10^2 \text{ s}^{-1}$ для алмаза. Как видно из табл. 3, для кристаллов Ge,Si и алмаза величины частот релаксации v_{phN}^{LLL} уменьшаются при переходе от направления [100] к направлению [111] примерно в 3 раза для кристаллов Ge и в 2 раза для кристаллов Si и алмаза.

0.0032

Алмаз

0.0012

При расчете теплопроводности кубических кристаллов следует учесть, что энергии актуальных для этих эффектов фононов ограничены сверху величинами $z_1 < 4-5$, поскольку большие значения экспоненциально обрезаются функцией распределения Планка. В этом интервале формула (15) для частоты релаксации фононов в механизме *LLL* может быть аппроксимирована более простым выражением

$$v_{\rm phN}^{LLL} \cong B_{LLL}^0 T^5 z_1 (1 + 0.03 z_1 + 0.00084 z_1^4), \qquad (31)$$

которое, как видно из рис. 1 (кривая 1*a*), хорошо согласуется со значениями, полученными из формулы (15) в интервале значений $0 < z_1 < 6$.

Рассмотрим теперь релаксацию продольных фононов в механизме *LTL* для кристаллов Ge, Si и алмаза. В длинноволновом пределе $z_1 \ll 1$ для механизма *LTL* из формулы (23) следует

$$\nu_{phN}^{LTL} \cong B_{LTL}^{0} T^{5} z_{1}^{4},$$

$$B_{LTL}^{0} = B_{LTL} \left(\left(\frac{1 - S^{*}}{S^{*}} \right)^{2} (1 + S^{*}) J_{0S} + \frac{(1 - S^{*})(1 + S^{*})^{2}}{2S^{*2}} J_{0R} \right),$$
(32)
$$J_{0S} \cong \int_{0}^{1} dy \, \frac{y \varphi_{1S}(y) B_{S}(y)}{\left(\frac{1 - S^{*}}{2S^{*}} + y \right)^{3}}, \quad J_{0R} \cong \int_{0}^{1} dy \, \frac{y \varphi_{1S}(y) B_{S}(y)}{\left(\frac{1 + S^{*}}{2S^{*}} - y \right)^{3}}.$$

Для кристаллов Ge величина $J_{0S} \approx 8$, а $J_{0R} \approx 4.7 \cdot 10^{-3}$. Поскольку для кристаллов Si и алмаза отношение $J_{0R}/J_{0S} \approx 10^{-3}$, то в этом пределе основной вклад в частоту релаксации продольных фононов вносят процессы слияния фононов, а вклад процессов распада пренебрежимо мал. Таким образом, в предельном случае длинных волн для механизма *LTL* частота релаксации продольных фононов в кубических кристаллах, как и в изотропных средах [12,23], пропорциональна четвертой степени волнового вектора фононов. Поэтому вклад этого механизма релаксации в поглощение длинноволнового ультразвука существенно меньше, чем рассмотренного ранее механизма *LLL* (см. (27)).

 $1.54 \cdot 10^{-6}$

 $1.33\cdot 10^{-6}$

Значения коэффициентов B_{LTL}^0 для кристаллов Ge, Si и алмаза в различных кристаллографических направлениях приведены в табл. 4, из которой следует, что в направлении [100] при T = 10 К и $z_1 = 1$ величина v_{phN}^{LTL} составляет $1.02 \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$ для Ge, $0.9 \cdot 10^4 \text{ s}^{-1}$ для Si и $0.32 \cdot 10^3 \text{ s}^{-1}$ для алмаза. Из табл. 4 видно, что кубическая анизотропия в длинноволновом приближении более существенно сказывается на частоте релаксации v_{phN}^{LTL} , чем на частоте релаксации v_{phN}^{LLL} . При переходе от направления [100] к направлению [111] коэффициент B_{LTL}^0 уменьшается более чем в 10 раз для кристаллов Ge, в 5 раз для кристаллов Si и почти в 3 раза для алмаза.

Рассмотрим теперь зависимость частоты релаксации ν_{phN}^{LTL} от температуры и волнового вектора для тепловых и высокочастотных фононов ($z_1 > 1$). Как видно из выражения (23), величина

$$\nu_{LTL}^{*}(z_{1}) = \frac{\nu_{phN}^{LTL}(z_{1}, T)}{B_{LTL}^{0}T^{5}} = \nu_{LTL}^{*(S)}(z_{1}) + \nu_{LTL}^{*(R)}(z_{1})$$
(33)

является функцией только приведенного волнового вектора фононов z_1 . На рис. 2 приведены зависимости величин $v_{LTL}^*(z_1)$, $v_{LTL}^{*(S)}(z_1)$ и $v_{LTL}^{*(R)}(z_1)$ от z_1 для кристаллов Ge, Si и алмаза. Как видно из рисунков, вклад S-процессов $v_{LTL}^{*(S)}(z_1)$ для этих кристаллов является немонотонной функцией z_1 . Величина $v_{LTL}^{*(S)}(z_1)$ сначала резко возрастает, как z_1^4 , достигает максимума при $z_1 \approx 4$, затем уменьшается, достигая минимума при $z_1 \approx 20$ для Ge, $z_1 \approx 14$ для Si и $z_1 \approx 9$ для алмаза, а при бо́льших значениях z_1 монотонно возрастает. Что касается процессов распада, то величина $v_{LTL}^{*(R)}(z_1)$ является монотонно возрастает, как z_1^4 (формула (23)), а при $z_1 > 10$ возрастает пропорционально z_1^5 , как и в изотропных

средах [26,27]. В последнем случае величина $v_{\text{phN}}^{LTL(R)}$ не зависит от температуры и пропорциональна q_1^5

$$\nu_{\text{phN}}^{LTL(R)} \cong B_{LTL}^{R} T^{5} z_{1}^{5}, \quad B_{LTL}^{(R)} = B_{LTL} (1 - S^{*}) J_{R},$$
$$J_{R} \cong \int_{0}^{1} dy \, \frac{y^{2} B_{R}(y) \varphi_{1R}(y)}{\left(\frac{1 \mp S^{*}}{2S^{*}} \pm y\right)^{2}}, \tag{34}$$

где функция $B_R(y)$ определена выражениями (23)–(25). Значения коэффициента $B_{LTL}^{(R)}$ для кристаллов Ge, Si и алмаза приведены в табл. 4, из которой следует, что для высокочастотных фононов кубическая анизотропия частоты релаксации v_{phN}^{LTL} существенно меньше, чем для длинноволновых. При переходе от направления [100] к направлению [111] величина коэффициента B_{LTL}^R уменьшается в 1.7 раза для кристаллов Ge и примерно в 1.4 раза для кристаллов Si и алмаза. Следует отметить, что в длинноволновом пределе, а также для тепловых фононов с $z_1 \approx 1-2$ роль распадных процессов мала. Однако при $z_1 \approx 5.4$ для кристаллов Ge и при $z_1 \approx 5.8$ для Si и алмаза вклады *R*-процессов и *S*-процессов сравниваются, а при бо́льших значениях волнового вектора z_1 доминирующий вклад в частоту релаксации v_{phN}^{LTL} вносят *R*-процессы.

При анализе теплопроводности кубических кристаллов использование формул (23)–(26) для частоты v_{phN}^{LTL} является неудобным из-за громоздкости. Поскольку энергии актуальных для теплопроводности фононов ограничены сверху значениями $z_1 < 4-5$, частота релаксации фононов v_{phN}^{LTL} в этом интервале может быть аппроксимирована более простым выражением

$$\nu_{\rm phN}^{LTL} \cong D_i B_{LTL}^0 T^5 z_1^4 \left(\exp(-\alpha_i z_1) + c_i \beta + 0.9 \gamma_i z_1 \right), \quad (35)$$
$$\beta = \frac{B_{LTL}}{B_{LTL}^0} \cdot \frac{(1 - S^*)(1 + S^*)^2}{2S^{*2}} J_{0R}, \quad \gamma = \frac{B_{LTL}^{(R)}}{B_{LTL}^0};$$

параметры D_i , α_i и c_i для Ge, Si и алмаза равны соответственно $D_i = 1.61$, 1.4, 2.09, $\alpha_i = 1.09$, 1.06, 0.9 и $c_i = 1.12$, 0.98, 0. Как видно из рис. 2 (кривые 1a), в интервале значений $0 < z_1 < 6$ аппроксимация (35) хорошо согласуется со значениями, полученными из формул (23)–(26). Заметим, что для тепловых фононов частоты релаксации фононов в механизмах *LTL* и *LLL* имеют одинаковый порядок величины и должны учитываться при расчете теплопроводности кристаллов Ge, Si и алмаза.

Рассмотрим, насколько сильно отличаются результаты, полученные для частот релаксации в механизме *LTL* кубических кристаллов Ge, Si и алмаза от случая изотропной среды. Для этого воспользуемся соотношениями (6) в выражениях (23) и (24). Тогда в функциях $B_S(y)$ и $B_R(y)$ в изотропном приближении останутся только члены, содержащие величину $A_{\rm cub}$, которая опре-



Рис. 2. Зависимости частот релаксации фононов в механизме *LTL* от приведенного волнового вектора z_1 для Ge (*a*), Si (*b*) и алмаза (*c*) в кристаллографическом направлении [100]: $1 - функция v_{LTL}^*$, 2 - вклад в частоту релаксации отS-процессов, <math>3 - вклад R-процессов. Штриховые линии *1а* соответствуют аппроксимации (35) для тепловых фононов.

деляется выражением (13а). Для сравнения на рис. З приведены зависимости $v_{LTL}^{*}(z_1)$, $v_{LTL}^{*(S)}(z_1)$ и $v_{LTL}^{*(R)}(z_1)$ от приведенного волнового вектора фононов в кубическом кристалле Si и Si в изотропном приближении. Как



Рис. 3. Зависимости частот релаксации фононов в механизме *LTL* для кубического кристалла Si в направлении [100] (1, 2, 3) и Si в изотропном приближении (1a, 2a, 3a); 1 и 1a — функция $v_{LTL}^*(z_1)$, 2 и 2a — вклад S-процессов, 3 и 3a — вклад R-процессов.

видно, изотропное приближение дает результаты для $v_{LTL}^{*}(z_{1})$, значительно отличающиеся от полученных для кубических кристаллов (кривые 1 и 1а). Хотя для процессов распада зависимости $v_{LTL}^{*(R)}(z_1)$ от приведенного волнового вектора фононов z_1 близки (кривые 3 и 3a), при $z_1 \gg 1$ изотропное приближение дает в 8.8 раз большие значения для частоты релаксации $v_{ITL}^{*(R)}(z_1)$, чем для кубического кристалла. Более существенно отличаются результаты для процессов слияния (кривые 2 и 2а на рис. 3). Во первых, в длинноволновом приближении величина коэффициента B⁰_{LTL} для Si в изотропном приближении в 1.9 раза больше, чем для кубического кристалла. Во-вторых, в изотропном приближении частота релаксации $v_{LTL}^{*(S)}(z_1)$ является монотонно возрастающей функцией z_1 (кривая 2*a* на рис. 3), тогда как для всех рассмотренных кубических кристаллов (кривые 2 на рис. 2) она имеет немонотонный характер. Проведенный анализ показал, что эти особенности частоты релаксации продольных фононов $\nu_{LTL}^{*(S)}(z_1)$ обусловлены угловой зависимостью вероятности ангармонического рассеяния (формулы (17), (18) и (23), (25)) и анизотропией упругих свойств кристаллов Ge, Si и алмаза. Очевидно, что для механизма релаксации продольных фононов LTL приближение изотропной среды является некорректным.

Итак, рассмотрена релаксация продольных фононов в механизмах $L \leftrightarrow L + L$ и $L \leftrightarrow T + L$ для кристаллов кубической симметрии. Получено выражение для упругой энергии, обусловленной ангармонизмом колебаний решетки кристалла кубической симметрии, через модули упругости второго и третьего порядков. Из известных значений модуля упругости второго и третьего порядков найдены параметры, определяющие величины частот релаксации продольных фононов для кристаллов Ge, Si и алмаза. Определены зависимости частот релаксации фононов от температуры и волнового вектора фононов для кристаллов германия, кремния и алмаза. Показано, что частоты релаксации фононов в механизме $L \leftrightarrow L + L$, рассчитанные в предположении о слабом затухании фононных состояний и пренебрежении дисперсией, для кубических кристаллов и соответствующих им изотропных приближений совпадают. В противоположность этому, зависимости частот релаксации от волнового вектора фононов в механизме $L \leftrightarrow T + L$, полученные для кристаллов кубической симметрии, существенно отличаются от случая изотропных сред. Для процессов слияния фононов в изотропном приближении частота релаксации является монотонно возрастающей функцией волнового вектора фононов, тогда как для всех рассмотренных кубических кристаллов в направлении [100] она имеет немонотонный характер. Установлено, что обнаруженные особенности частоты релаксации продольных фононов в механизме $L \leftrightarrow T + L$ обусловлены угловой зависимостью вероятности агнармонического рассеяния и анизотропией упругих свойств рассмотренных кристаллов.

Авторы выражают благодарность А.П. Танкееву за обсуждение результатов работы и критические замечания.

Список литературы

- [1] В.Л. Гуревич. Кинетика фононных систем. Наука, М. (1980).
- [2] B. Truel, C. Elbaum, B.B. Chick. Ultrasonic methods in sold state physics. Academic press, N.Y.–London (1969).
- [3] В.М. Аскеров. Электронные явления переноса в полупроводниках. Наука, М. (1985).
- [4] А.П. Жернов, А.В. Инюшкин. Изотопические эффекты в твердых телах. Российский научный центр "Курчатовский институт", М. (2001).
- [5] M. Asen-Palmer, K. Bartkowski, E. Gmelin, M. Cardona, A.P. Zhernov, A.V. Inyushkin, A.N. Taldenkov, V.I. Ozhogin, K.M. Itoh, E.E. Haller. Phys. Rev. B 56, 15, 9431 (1997).
- [6] T. Ruf, R.W. Henn, M. Asen-Palmer, E. Gmelin, M. Cardona, H.-J. Pohl, G.G. Devyatych, P.G. Sennikov. Sol. Stat. Commun. 115, 5, 243 (2000).
- [7] J.E. Graebner, M.E. Reiss, L. Seibles, T.M. Hartnett, R.P. Miller, C.J. Robinson. Phys. Rev. B 50, 6, 3702 (1994).
- [8] J.R. Olson, R.O. Phol, J.W. Vandersande, A. Zolten, T.R. Anthony, W.F. Banholzer. Phys. Rev. B 47, 22, 14850 (1993).
- [9] И.Г. Кулеев, И.И. Кулеев. ЖЭТФ 120, 6, 649 (2001).
- [10] И.Г. Кулеев, И.И. Кулеев. ЖЭТФ 121, 6, 558 (2002).
- [11] Р. Берман. Теплопроводность твердых тел. Мир, М. (1979).
- [12] Б.М. Могилевский, А.Ф. Чудновский. Теплопроводность полупроводников. Наука, М. (1972).
- [13] F. Birch. Phys. Rev. 71, 11, 809 (1947).
- [14] Л.К. Зарембо, В.А. Красильников. Введение в нелинейную акустику. Наука, М. (1966).

- [15] Дж. Такер, В. Рэмптон. Гиперзвук в физике твердого тела. Мир, М. (1975).
- [16] T. Bateman, W.P. Mason, H.J. McSkimin. J. Appl. Phys. 32, 5, 928 (1961); H.J. McSkimin, P. Andreath. J. Appl. Phys. 35, 11, 3312 (1964).
- [17] M.H. Grimsditch, E. Anastassakis, M. Cardona. Phys. Rev. B 18, 2, 901 (1978).
- [18] W.P. Mason. Phys. Acoustics III-Part B, 235 (1965).
- [19] И.Н. Францевич, Ф.Ф. Воронов, С.А. Бакута. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов. Наук. думка, Киев (1982).
- [20] K. Brugger. Phys. Rev. 133A, 6, 1611 (1964).
- [21] R.N. Thurston. Phys. Acoustics I-Part A, 235 (1964).
- [22] Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц. Теория упругости. Наука, М. (1987).
- [23] H.J. Maris. Phys. Acoustics VII, 280 (1971).
- [24] S. Tamura. Phys. Rev. B 34, 4, 2574 (1985).
- [25] П.С. Зырянов, Г.Г. Талуц. ЖЭТФ 49, 6, 1942 (1965).
- [26] Г.Л. Слонимский. ЖЭТФ 7, 12, 1457 (1937).
- [27] R. Orbach, L.A. Vredevoe. Physics 1, 2, 91 (1964).